

國立臺灣師範大學機電工程學系電子顯微鏡使用申請表

申請人姓名：_____	申請日期：____年____月____日 (請務必於使用前 2 日提出申請)
服務單位：_____	使用日期：____年____月____日
申請人簽章：_____	使用時間：____時____分 (請務必依申請時間準時報到，違者依規定停權)
聯絡電話：_____	審核人簽章：_____
服務項目： ☐ 表面觀察 ☐ 照相 ☐ EDS 分析 ☐ 其他	
試片名稱：_____ 材料種類：_____	
狀態： ☐ 固體 ☐ 粉末	
性質： ☐ 穩定 ☐ 揮發性 ☐ 磁性 ☐ 毒性	
試片處理： ☐ 真空鍍金 ☐ 真空鍍碳 ☐ 脫水	
備註及說明：_____ _____ _____	

● 服務項目

一、(1)SEI(Scanning Electron Image)，影像觀察，破斷面，金相表面觀察。

(2)BEI(Backscattered Electron Image)：TOPO(Topography)，表面觀察。COMPO(Composition)，元素鑑別及分析。

二、「能量分析散光譜儀」(Energy Dispersive X-ray Spectrometer)可作微區成分之定性、半定量分析。

● 注意事項

一、試片取樣直徑最大不超過 25mm(最好在 10mm 以內為宜)，最大高度 10mm，試件請自行前處理。

二、如為非金屬、高分子、粉體試片，請務必做固定及蒸鍍處理。若欲影像觀察，請先鍍金；若需定性、半定量分析，則選擇碳鍍膜。在電子束照射下會分解或釋出氣體之試片禁止使用。

三、本儀器拒絕受理含有毒性、腐蝕性、揮發性、磁性、水分及低熔點之試片。